

2022-2023 春《测度与积分》期末（回忆）

2023 年 6 月 10 日

- (1) 设 A 是 Hilbert 空间 H 的闭子空间且 $A \neq H$, 证明对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $x \in H$, $\|x\| = 1$, 使得 $\text{dist}(x, A) > 1 - \varepsilon$.
- (2) 设 Hilbert 空间 H 中单位球是紧的, 证明 H 是有限维的.
- (3) 设 T 是 Hilbert 空间 H 上的紧算子, 证明 0 是 T 的连续谱点, 即 T 不存在有界算子逆.
- (4) 设 T 是 Hilbert 空间 H 上的紧算子, 证明 $I - T$ 的零空间 $\ker(I - T)$ 是有限维的.
- (5) 设 T 是 Hilbert 空间 H 上紧算子, 证明 $I - T$ 的像空间 $\text{Ran}(I - T)$ 是闭的.

- 设 $H = L^2([a, b])$, $\{\varphi_k\}_{k \geq 1}$ 是 H 的规范正交基. $\{\psi_k\}_{k \geq 1}$ 是一列正交向量组, 而且满足:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b |\varphi_k(x) - \psi_k(x)|^2 dx < 1.$$

证明 $\{\psi_k\}_{k \geq 1}$ 是 H 的一组正交基.

- 定义 \mathcal{M}_+ 是 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B})$ 上全体有限的 (正的) Borel 测度. 设 $\mu, \nu \in \mathcal{M}_+$, 定义 μ 和 ν 的卷积为 $(\mu * \nu)(E) = \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \chi_E(x + y) d\mu(x) d\nu(y)$.

证明卷积满足交换律和结合律, 即 $\mu * \nu = \nu * \mu$, $(\mu * \nu) * \rho = \mu * (\nu * \rho)$; 并说明是否存在卷积单位元, 即是否存在 $\nu \in \mathcal{M}_+$, 使得对任何 $\mu \in \mathcal{M}_+$, 都有 $\mu * \nu = \mu$?

- 对 $j = 1, 2$, 令 μ_j, ν_j 是 (X_j, \mathcal{M}_j) 上两个 σ -有限的正测度, 满足 $\nu_j \ll \mu_j$. i 证明 $\nu_1 \times \nu_2 \ll \mu_1 \times \mu_2$, 而且其 Radon-Nikodym 导数满足:

$$\frac{d\nu_1 \times \nu_2}{d\mu_1 \times \mu_2}(x_1, x_2) = \frac{d\nu_1}{d\mu_1}(x_1) \frac{d\nu_2}{d\mu_2}(x_2).$$

- 设 $H = L^2((0, 1))$, 定义其上的算子 $\mathcal{A}: x(t) \mapsto tx(t)$.

- (1) 证明 \mathcal{A} 是有界、对称算子, 但不是紧算子;
- (2) 证明 \mathcal{A} 没有特征向量;
- (3) 对任何 $0 < \lambda < 1$, 证明 λ 不是 \mathcal{A} 的谱点 (即 $\ker(\lambda I - \mathcal{A}) = \{0\}$), 且 $\overline{\text{Ran}(\lambda I - \mathcal{A})} = H$, 但 $\text{Ran}(\lambda I - \mathcal{A}) \neq H$.

- 设 μ^* 为 X 上外测度, \mathcal{M} 为 μ^* -可测集组成的 σ -代数, $\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}}$ 为测度. $E \subset X$, 且 $\mu^*(E) = \mu^*(X)$ (E 未必属于 \mathcal{M})

- (1) 设 $A, B \in \mathcal{M}$ 且满足 $A \cap E = B \cap E$, 证明 $\mu(A) = \mu(B)$;
- (2) 记 $\mathcal{M}_E = \{A \cap E : A \in \mathcal{M}\}$, 证明 \mathcal{M}_E 是 σ -代数. 对 $A \cap E \in \mathcal{M}_E$ 定义 $\nu(A \cap E) = \mu(A)$, 证明 ν 是 \mathcal{M}_E 上的测度.